



Fundamentals of atomic force microscopy.

Reifenberger, Ronald G.,

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,
[2016]

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTc4MjUyNzk>

Título: Fundamentals of atomic force microscopy. Part I Foundations Recurso electrónico] Ronald Reifenberger

Editorial: Singapore Hackensack, NJ World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. [2016]

Descripción física: 1 recurso electrónico

Variantes del título: Foundations

Mención de serie: EBSCO Academic eBook Collection Complete Lessons from nanoscience vol. 4

Bibliografía: Incluye referencias bibliográficas e índice

Detalles del sistema: Forma de acceso: World Wide Web

ISBN: 9814630365 9789814630368 9789814630344 hbk.) 9789814630351 pbk.) 9814630349 9814630357

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es